



# 表面性状測定結果

プロパティ

タイトル	Rz6	作成者	OPTIPLEX XE2	改訂番号	2
サブタイトル		更新者	OPTIPLEX XE2		

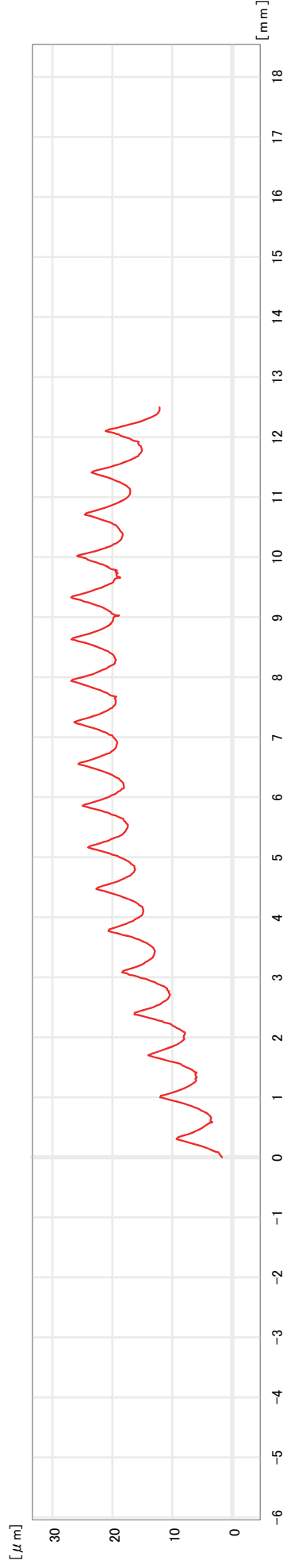
測定結果

Ra	測定内容	測定値	測定内容	測定値
		1.9324 $\mu$ m	Rz	7.7360 $\mu$ m

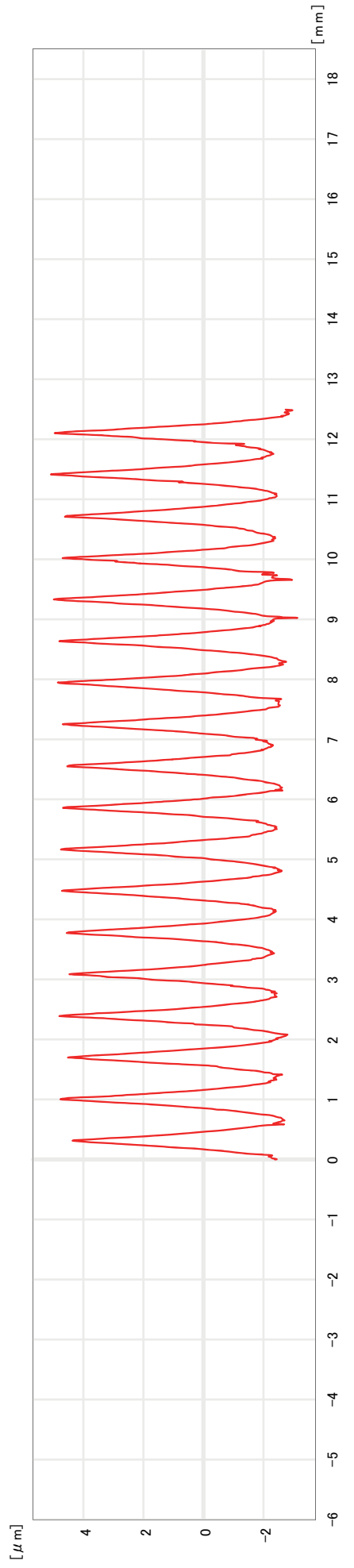
測定条件

測定機	SV-C3200	Z軸レンズ	0.8000mm	真直度補正(X軸)	なし
測定長さ(X)	12.5000mm	サンプリング方法	X軸ピッチ	スタイラス半径補正	なし
測定ピッチ	0.0010mm	Z軸ゲイン調整率	1.054753	極性反転	なし
測定速度	2.00mm/sec	対称性補正	なし		

測定曲線 X倍率: x10 Z倍率: x1000 <Roughness\_1>



曲線=R\_J01 - 箇所=[1] X倍率: x10 Z倍率: x5000 <Roughness\_1>



ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)

測定内容  
粗さ解析<Roughness\_1>

Ra  
Rz  
RzJIS

測定値  
0.0019mm  
0.0077mm  
E\_20002

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 設定(S) 測定手順(P) 測定(M) レイアウト(L) ツール(T) ヘルプ(H)

新規 開く 保存 測定手順 手順モード

シリアル タイピング

粗さ測定

極座標 計算ツール 測定画面 計算画面 縮小 拡大

自動倍率

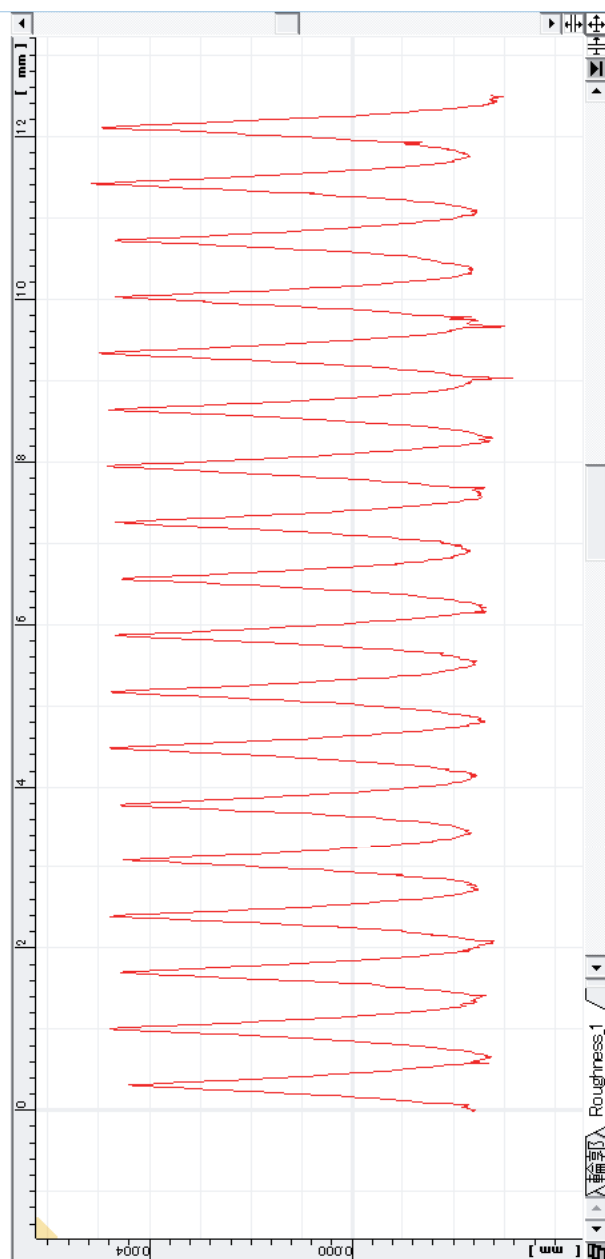
縦倍率 9985.049 縦倍率 固定

横倍率 16.47

測定手順

測定手順

- 測定手順
- 測定<Meas\_1>
- 粗さ解析<Roughness\_1>
- 曲線=R\_001 - 箇所=()
- 測定曲線
- END



測定内容 測定値 判定 照合結果 上限許容差 下限許容差

粗さ解析<Roughness\_1>

曲線=R\_001 - 箇所=()

Ra 0.0019mm

Rz 0.0077mm

RzJIS E\_20002

参照している測定

測定<Meas\_1>